



SEM観察ウェビナー ～前処理技術とSEMの 最新アプリケーションを徹底解説！～

参加費
無料

様々な分野において、微小領域における材料特性の研究や製品開発、そして不良・故障解析に使用されている走査電子顕微鏡 (SEM) は広く活用されています。また、SEMによる観察はサンプルの試料作成の良否によって大きく結果が異なってまいります。サンプル本来の評価をするためには、最適な試料作製が不可欠です。本ウェビナーでは、SEMの最新アプリケーションの紹介からSEMをさらに活用するための前処理技術の紹介をいたします。皆様のご参加をお待ちしておりますので、ご検討いただきますようお願い申し上げます。

開催日時、申し込み方法

8月22日(木) 15:00～16:30

申し込み方法：下記URLもしくは右のQRコードからの登録フォームにて
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_gp5rkDmSQ-mzERReIW8d2g



- ・ ウェビナーお申込みは上記URLをクリックするか、QRコードをスマホやタブレット等で読み込みください。
- ・ 本セミナーはZoomウェビナーを使用します。パソコン、またはタブレットの場合はアプリをダウンロードする必要なしにブラウザで参加できます。
- ・ 推奨ブラウザ：Microsoft Edgeまたは Google Chrome

講演プログラム

**講演1 「～大型試料をナノレベルまで観察！～
最新の高分解能ショットキーSEM活用事例の紹介」**
株式会社日立ハイテク 解析システム4部 田代靖晃



高分解能ショットキー
走査電子顕微鏡
SU3900SEシリーズ

大型で重量のある試料をナノレベルまで高精度かつ効率的な観察を可能にした高分解能ショットキー走査電子顕微鏡 SU3900SEシリーズは様々な分野での応用が可能です。本講演では、大型試料～小型試料を解析・分析を実現するSEMの活用から最新アプリケーションについてご紹介致します。また、多数の検出系や低真空など多種多様な試料への解析手法のご提案を致します。

**講演2 「～SEM断面観察の最前線！～
イオンミリングを用いた最新の断面作製の事例紹介」**
株式会社日立ハイテク グローバル営業企画部 振木昌成



イオンミリング装置
Arblade5000

微細化、複雑化が進む試料構造の評価に對して、イオンミリングによる断面作製が広く用いられています。イオンミリングは無応力での試料加工が大きな特徴で、電子部品や金属セラミックスの材料評価など断面作製が可能です。本講演では、一般的な試料前処理の基礎とイオンミリングによる優位点、最新アプリケーションについてご紹介致します。イオンミリングの概要紹介から装置を使用する上でのポイントなども紹介致します。

**講演3 「～試料作製のお悩みごとを解決！～
ポイント徹底解説・機器ご紹介」**
メッツ・ジャパン株式会社 営業部 技術統括 大月華奈子



試料精密切断機
MEGATOME T215

SEMによる観察は試料作製の良否によって大きく左右されます。切断時に傾いてしまう、埋込時に隙間ができてしまう、研磨時に傷が残ってしまう、最適な工程が分からないなどのお悩みはありませんか？本講演では、切断・埋込・研磨という前処理工程において、よく皆様からいただくお悩みに対する解決ポイント、解決に役立つ製品のご紹介致します。

**講演4 「～粒子観察の前処理に革新！～
粒子分散ユニットを用いた粒子観察の前処理技術」**
株式会社堀場製作所 営業本部 足立暁



粒子分散ユニット
Particle Dispenser

SEMなどを用いた粒子・粉末の観察には前処理として粒子を分散させることが必要不可欠ですが、粒子の重なりや塊になってしまうことで、粒子ごとの観察が出来ないという経験はありませんか？本講演では、凝集しやすい粉末粒子を均一に分散できる粒子分散ユニットによる粒子観察の前処理の実例をご紹介致します。